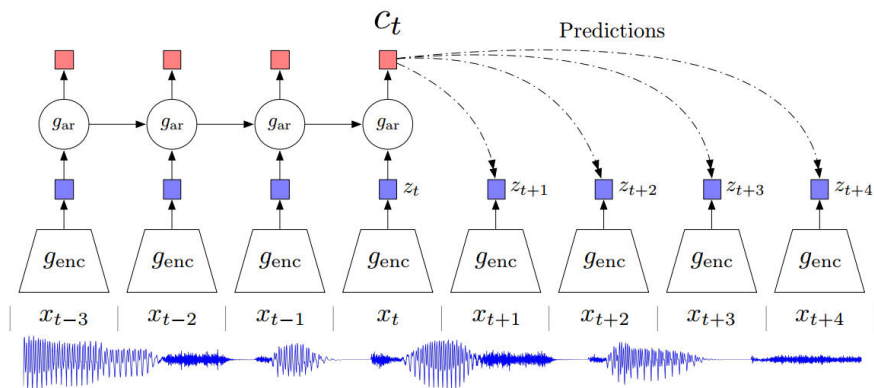


CPC (Contrastive Predictive Coding) 表征学习

框架



原始数据 \times $\xrightarrow[\text{genc}]{\text{非线性编码器}}$ 潜在表征序列 z_t $\xrightarrow[\text{gar}]{\text{自回归函数}}$ 历史信息表征集 C_t

$$z_t = \text{genc}(x_t)$$

利用历史信息 C_t 来预测未来表征 z_{t+k}

$$C_t = \text{gar}(z_{\leq t})$$

我们把模型的预测能力建模成函数 $f_k(x_{t+k}, C_t)$

$$f_k(x_{t+k}, C_t) = \exp(z_{t+k}^T W_k C_t)$$

真实特征 \times 根据历史信息, 经过权重 W_k 预测值

我们希望对于输入 x_{t+k}, C_t , f_k 的输出尽可能大

W_k 是学习的参数.

那么如何学习到 W_k 呢?

通过构建正负样本对, 使正样本对得分高于负样本对

一组 sample $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 其中:

正样本对 $\{C_t, x_i\}$, 其余为负样本对

所以这里存在一个分类任务:

我们希望:

$$P(d=i | X, C_t) \gg P(d=j, i \neq i) | X, C_t)$$

$$\begin{aligned} P(d=i | X, C_t) &= \frac{P(d=i, X | C_t)}{\sum_{j=1}^N P(d=j, X | C_t)} = \frac{P(X_i | C_t) \cdot \prod_{i \neq i} P(X_i)}{\sum_{j=1}^N [P(X_j | C_t) \prod_{i \neq j} P(X_i)]} \\ &= \frac{P(X_i | C_t)}{P(X_i)} \cdot \frac{1}{\sum_{j=1}^N \frac{P(X_j | C_t)}{P(X_j)}} \end{aligned}$$

$P(d=i | X, C_t)$ 是正确分类的条件概率

可以认为 正确预测 和 正确分类 两个任务是 - 一定程度等价的

所以可以得出

$$f_k(X_{t+k}, C_t) \propto \frac{P(X_{t+k} | C_t)}{P(X_{t+k})}$$

→ 涉及真实条件概率
和高维数据。
很难计算

损失函数设计:

$$L_N = - \mathbb{E}_X \left[\log \frac{f_k(X_{t+k}, C_t)}{\sum_{x_i \in X} f_k(X_i, C_t)} \right]$$

进一步证明损失函数的有效性

$$L_N = - \mathbb{E}_X \left[\log \frac{P(X_{t+k} | C_t)}{P(X_{t+k})} \cdot \frac{1}{\frac{P(X_{t+k} | C_t)}{P(X_{t+k})} + \sum_{x_i \in X_{neg}} \frac{P(X_i | C_t)}{P(X_i)}} \right]$$

$$= \mathbb{E}_x \log \left[1 + \frac{P(X_{t+k})}{P(X_{t+k}|C_t)} \sum_{x_j \in X_{neg}} \frac{P(x_j|C_t)}{P(x_j)} \right]$$

$$\approx \mathbb{E}_x \log \left[1 + \frac{P(X_{t+k})}{P(X_{t+k}|C_t)} (N-1) \mathbb{E}_{x_j} \frac{P(x_j|C_t)}{P(x_j)} \right]$$

$$= \mathbb{E}_x \log \left[1 + \frac{P(X_{t+k})}{P(X_{t+k}|C_t)} (N-1) \right] \quad \frac{P(X_{t+k})}{P(X_{t+k}|C_t)} < 1$$

$$\geq \mathbb{E}_x \log \left[\frac{P(X_{t+k})}{P(X_{t+k}|C_t)} N \right]$$

$$= \mathbb{E}_x \log \frac{P(X_{t+k})}{P(X_{t+k}|C_t)} + \log N$$

$$= - \sum_{x \in X} P(x, C) \log \frac{P(X_{t+k}|C_t)}{P(X_{t+k})} + \log N$$

$$= - \frac{I(X_{t+k}, C_t) + \log N}{\text{互信息}}$$

$$\therefore I(X_{t+k}, C_t) \geq \log N - \epsilon_N$$

$$\epsilon_N \uparrow, I \uparrow$$